

Uma breve história dos nossos microscópios mais importantes

Produtos principais

Nós começamos a fabricar microscópios para ciências da vida em 1919. Dez anos depois, começamos a utilizar nossa tecnologia em microscópios para aplicações industriais. O resto é história!



1929 Nossa primeira incursão na inspeção industrial foi com o microscópio metalúrgico MC

1955 Nosso primeiro microscópio de metrologia — o microinterferômetro MI

1968 Aproveitamos o desenvolvimento tecnológico da área médica e lançamos a série IFS, nosso primeiro produto de RVI industrial



1973 Lançamento do modelo 5221, primeiro medidor de espessura industrial ultrassônico com medição multimodo e calibração de velocidade de propagação

1984 Lançamento do EPOCH® 2002, primeiro detector de defeitos portátil completamente digital

1988 Lançamento do primeiro medidor de espessura do mundo com datalogger interno, 22DL

1994 Introduzimos recursos de gerenciamento de arquivos e datalogger no detector de defeitos portátil ultrassônico EPOCH III

└ Lançamento do nosso primeiro microscópio a laser, OLS1000

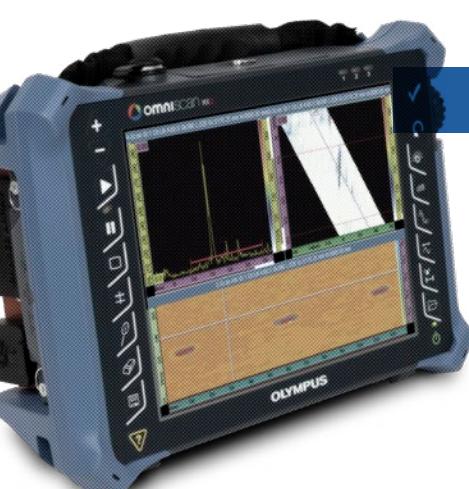


2001 O XT foi o primeiro analisador por XRF

└ Lançamento dos nossos populares videscópios da série IPLEX™



2003 Com o lançamento do OmniScan®, o Phased Array torna-se portátil



2008 Finalmente, os analisadores XRD são pequenos o bastante para serem utilizados em uma bancada ou em campo com o lançamento dos analisadores BTX® e TERRA®

2010 Portátil, funcional e robusto — lançamento do detector de defeitos EPOCH 600

2011 Nossa dispositivo de Phased Array campeão de vendas, OmniScan MX2

2012 Com o lançamento da série DSX, os microscópios tornam-se digitais

2014 Detector de defeitos por correntes parasitas NORTEC® 600

2016 Lançamento do primeiro analisador portátil por XRF projetado para IP64/65, analisador Vanta™

└ Chega o RVI de alta resolução com o videoscópio IPLEX NX

2017 Nossa detector de defeitos ultraportátil, EPOCH 6LT

└ Uma nova era de trabalho conectado com a Olympus Scientific Cloud™

